

## ★信頼性研究会 (R)

専門委員長 木村光宏 副委員長 馬渡宏泰  
幹事 安里 彰・岡村寛之 幹事補佐 マラット ザニケエフ・田村信幸

## ★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 関川純哉 副委員長 久我宣裕  
幹事 服部康弘・阿部宜輝 幹事補佐 和田真一

日時 2月20日(金) 14:15~16:15

会場 静岡大学浜松キャンパス佐鳴会館会議室(浜松市中区城北3-5-1. JR浜松駅北口バスターミナルからバスで約20分, バスターミナル15, 16番乗り場からの全路線, 「静岡大学」下車. <http://www.eng.shizuoka.ac.jp/outlines/p07/> TEL [053] 478-1618 関川純哉)

議題 機構デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. DC450V回路の開離時アークにもたらす高分子材料壁の冷却効果の影響 ○小西弘純・関川純哉(静岡大)
2. 窒素ガス吹き付け下での開離時アーク発生後の銀接点表面の成分分布 ○渥美知之・関川純哉(静岡大)
3. Degradation phenomenon of electrical contacts by using a micro-sliding mechanism—The effective parameters on the minimal sliding amplitude—  
○Shin-ich Wada・Keiji Koshida・Hiroaki Kubota (TMC)・Koichiro Sawa (Nippon Inst. of Tech.)
4. 燃料ポンプ用DCモータのブラシ及び整流子のエタノール中での摩耗・消耗  
○澤 孝一郎・石原圭悟・新井瑞季・上野貴博(日本工大)

◆継電器・コンタクトテクノロジー研究会, IEEE Reliability Society Japan Chapter, 静岡大学共催

日本信頼性学会協賛

☆R研究会

### 【問合先】

安里 彰(富士通)

E-mail: [asato@jp.fujitsu.com](mailto:asato@jp.fujitsu.com)

☆EMD研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

3月6日(金) 千葉工大津田沼〔締切済〕テーマ: ショートノート(卒論・修論特集)

5月15日(金) 秋田大手形キャンパス〔3月5日(木)〕テーマ: 一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

### 【問合先】

関川純哉(静岡大)

TEL & FAX [053] 478-1618

E-mail: [tjsekik@ipc.shizuoka.ac.jp](mailto:tjsekik@ipc.shizuoka.ac.jp)

久我宣裕(横浜国大)

TEL & FAX [045] 339-4279

E-mail: [kuga@ynu.ac.jp](mailto:kuga@ynu.ac.jp)

服部康弘(住友電装)

TEL [059] 382-8634, FAX [059] 382-8591

E-mail: [yasuhiro-hattori@gate.sws.co.jp](mailto:yasuhiro-hattori@gate.sws.co.jp)

阿部宜輝(NTT デバイスイノベーションセンタ)

TEL [046] 240-2262, FAX [046] 270-6421

E-mail: [abe.yoshiteru@lab.ntt.co.jp](mailto:abe.yoshiteru@lab.ntt.co.jp)

◎EMD研究会に関する最新の情報は, <http://www.ieice.org/es/emd/jpn/>を御参照下さい。